```
1/9/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.
             **Image available**
014313113
WPI Acc No: 2002-133815/200218
XRAM Acc No: C02-041195
XRPX Acc No: N02-101222
 Film for interlayer insulating film, used in semiconductor elements, has
 specific film density
Patent Assignee: JSR CORP (JAPS )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
Patent No Kind Date
                             Applicat No
                                           Kind Date
JP 2001203197 A 20010727 JP 200012513 A
                                                 20000121 200218 B
Priority Applications (No Type Date): JP 200012513 A 20000121
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                     Filing Notes
JP 2001203197 A 20 H0<del>1</del>L-021/312
Abstract (Basic): JP 2001203197 A
        NOVELTY - A film has a film density of 0.5 - 1.4 q/cm3.
        DETAILED DESCRIPTION - The film consists of formula (1).
        x=1.3 - 1.9;
        y=0.2 - 8.0;
        z=0.6 - 7.0
        USE - The method forms the film for an interlayer insulating film
    for use in a semiconductor element.
        ADVANTAGE - The film has superior dielectric constant and
    mechanical strength.
        pp; 20 DwgNo 0/0
Technology Focus:
        TECHNOLOGY FOCUS - ORGANIC CHEMISTRY - The film satisfies
    conditions (a) - (d):
        (a) elastic modulus=more than 2.5 GPa;
        (b) cohesive failure strength=at least 30 MPa;
        (c) refractive index=at most 1.40; and
        (d) 1 % weight reduction temperature=at least 400 degreesC.
        The film is formed on a substrate for a semiconductor. The
    formation of the film comprises: (A) preparing a composition
    containing: (a) at least one silane compound selected from the group of
    a compound of formula (2), and a compound of formula (3), or its
    hydrolyzed product and/or its condensate; (b) an organic polymer; and
    (c) an organic solvent; (B) applying the composition to the substrate;
    and (C) heating the composition.
        R1, R2=monovalent organic group;
        R=divalent organic group;
        n=integer of 0 - 2;
        s, t=integer of 0 - 1.
Title Terms: FILM; INTERLAYER; INSULATE; FILM; SEMICONDUCTOR; ELEMENT;
  SPECIFIC; FILM; DENSITY
Derwent Class: A82; A85; G02; L03; U11
International Patent Class (Main): H01L-021/312
International Patent Class (Additional): C09D-005/25; C09D-183/06;
  H01L-021/316
File Segment: CPI; EPI
Manual Codes (CPI/A-N): A06-A00E2; A12-E07C; G02-A05B; L04-C12E
Manual Codes (EPI/S-X): U11-A01A1
```

# Japanese Patent Provisional Publication No. 2001-203197

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-203197

(P2001-203197A) (43)公開日 平成13年7月27日(2001.7.27)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI		テーマコート	(参考)
H01L 21/312		H01L 21/312	С	4J038	
CO9D 5/25		C09D 5/25		5F058	
183/06		183/06			
H01L 21/316		H01L 21/316	G		

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全20頁)

(21)出願番号	特願2000-12513(P2000-12513)	(71)出願人	000004178
			ジェイエスアール株式会社
(22) 出願日	平成12年1月21日(2000.1.21)		東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	塩田 淳
			東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
			エスアール株式会社内
		(72)発明者	黒澤 孝彦
	•		東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
			エスアール株式会社内
		(74)代理人	100085224
			弁理士 白井 重隆
·	•	1	
			最終頁に続

# (54) 【発明の名称】膜、および膜の形成方法

# (57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜として有 用な、低誘電率、髙弾性率のポリオルガノシロキサン系 の膜を得る。

【解決手段】 下記一般式(1)で表される構造からな り、かつ膜密度が0.5~1.4g/cm゚であるポリ オルガノシロキサン系の膜。

 $SiOxCyHz\cdots$  (1)

で(式中、1.3~x<1.9、0.2<y<8.0、

0.6<z<7.0である。)

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される構造からな り、かつ膜密度が 0. 5~1. 4g/cm であること を特徴とする膜。

1

 $SiOxCyHz \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 

(式中、1.3<x<1.9、0.2<y<8.0、 0.6<z<7.0である。)

【請求項2】 炭素含有量が1.0×10°~3.0× 10<sup>2</sup> a t m/c m<sup>3</sup> である請求項1記載の膜。

【請求項3】 膜厚が3 μ m以下である請求項1記載の 10 膜。

【請求項4】 BJH法による空孔分布測定による10 nm以上の空孔が5%以下である請求項1記載の膜。

【請求項5】 電子顕微鏡観察による空孔径測定による 1 n m以上の空孔が5個/100 n m 以下である請求 項1記載の膜.

【請求項6】 下記の(a)~(d)の条件を満たす請 求項1記載の膜。

- (a) 弹性率≥2.5GPa
- (b) 凝集破壊強度≥30MPa
- (c) 屈折率≤1.40
- (d) 1%重量減少温度≥400℃

【請求項7】 半導体用基体上に形成された請求項1記 載の膜。

【請求項8】 半導体装置の1部を構成する請求項1記 載の膜。

【請求項9】 請求項1記載の膜からなる絶縁膜。

【請求項10】 (A) 下記一般式(2) で表される化 合物および下記一般式(3)で表される化合物の群から 物および/またはその縮合物、

$$R^{2}$$
, Si  $(OR^{1})$ ,  $\cdots$   $(2)$   
 $R^{2}$ ,  $(R^{1} O)$ <sub>3-1</sub>, SiRSi  $(OR^{1})$ <sub>3-1</sub>,  $R^{2}$ ,  $\cdots$   $(3)$ 

〔一般式(2)~(3)中、R'およびR'は、同一で も異なっていても良く、それぞれ1価の有機基、Rは2 価の有機基を示し、nは0~2の整数、sおよびtは0 ~1の整数である。〕

- (B) 有機ポリマー、ならびに
- (C) 有機溶媒

を含む膜形成用組成物を、基体に塗布し、加熱すること を特徴とする、請求項1~9いずれか1項記載の膜の形 成方法。

(A) 下記一般式(2) で表される化 【請求項11】 合物および下記一般式(3)で表される化合物の群から 選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を、

 $R^2$  , S i (OR') +

 $R^{2}$ ,  $(R^{1} O)_{B-1}$  SiRSi  $(OR^{1})_{B-1}$   $R^{2}$  $\cdots \cdots (3)$ 

[一般式 (2) ~ (3) 中、R' およびR' は、同一で 50 SiOxCyHz・・・・ (1)

も異なっていても良く、それぞれ1価の有機基、Rは2 価の有機基を示し、nは0~2の整数、sおよびtは0 ~1の整数である。]

### (D) アルカリ触媒

の存在下に、加水分解・縮合して得られる加水分解縮合 物の重量平均分子量を5万~1,000万となした膜形 成用組成物を、基体に塗布し、加熱することを特徴とす る、請求項1~9いずれか1項記載の膜の形成方法。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特定構造の低密度 膜、およびこの膜の形成方法に関し、さらに詳しくは、 誘電率特性、機械強度などに優れた膜、およびこの膜の 形成方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスにより形成され たシリカ(SiO,)膜が多用されている。そして、近 年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的とし 20 て、SOG (Spin on Glass) 膜と呼ばれ るテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とす る塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。ま た、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼 ばれるオルガノポリシロキサンを主成分とする低誘電率 の層間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導体 素子などのさらなる高集積化に伴い、より優れた導体間 の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低誘 電率の層間絶縁膜材料が求められるようになっている。 【0003】そこで、特開平6-181201号公報に

選ばれた少なくとも1種のシラン化合物、その加水分解 30 は、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成 用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、 チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素 化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成 物である。しかしながら、従来の無機系層間絶縁膜材料・ 40 の誘電率は、3. 0以上であり、高集積化には不充分で ある。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、誘電率特性 を改善し、機械強度などのバランスにも優れた層間絶縁 膜に適した膜を提供することを目的とする。

### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記一般式 (1)で表される構造からなり、かつ膜密度が0.5~ 1. 4g/cm³ であることを特徴とする膜に関する。

(式中、1.3 < x < 1.9、0.2 < y < 8.0、 0.6<z<7.0である。) ここで、上記膜は、炭素含有量が1.0×10°~3. 0×10<sup>m</sup> a t m/c m³ であることが好ましい。ま た、上記膜は、膜厚が3μm以下であることが好まし い。さらに、上記膜は、BJH法による空孔分布測定に よる10 n m以上の空孔が5%以下であることが好まし い。さらに、上記膜は、電子顕微鏡観察による空孔径測 定による1 n m以上の空孔が5個/100 n m 以下で

あることが好ましい。さらに、上記膜は、下記の (a)

- (a) 弹性率≥2.5GPa
- (b) 凝集破壞強度≥30MPa

~ (d) の条件を満たすことが好ましい。

- (c)屈折率≦1.40
- (d) 1%重量減少温度≥400℃

さらに、上記膜としては、半導体用基体上に形成された 膜が挙げられる。また、上記膜としては、半導体装置の 1部を構成する膜が挙げられる。さらに、上記膜として は、絶縁膜が挙げられる。次に、本発明は、(A)下記 一般式(2)で表される化合物(以下「化合物(2)」 ともいう) および下記一般式(3) で表される化合物 (以下「化合物(3)」ともいう)の群から選ばれた少 なくとも1種のシラン化合物、その加水分解物および/ またはその縮合物、

$$R^{2}$$
 , Si  $(OR^{1})$  ,  $\cdots$  (2)  
 $R^{2}$  ,  $(R^{1} O)$  <sub>3-</sub>, SiRSi  $(OR^{1})$ <sub>3-1</sub>,  $R^{2}$  ,  $\cdots$  (3)

〔一般式(2)~(3)中、R¹およびR¹は、同一で も異なっていても良く、それぞれ1価の有機基、Rは2 ~1の整数である。〕

- (B) 有機ポリマー、ならびに
- (C) 有機溶媒

を含む膜形成用組成物(以下「組成物(1)」ともい う) を、基体に塗布し、加熱することを特徴とする、上 記膜の形成方法(以下「形成方法(1)」ともいう)に 関する。次に、本発明は、(A)下記一般式(2)で表 される化合物〔化合物(2)〕および下記一般式(3) で表される化合物〔化合物(3)〕の群から選ばれた少 なくとも1種のシラン化合物を、

$$R^{2}$$
, Si  $(OR^{1})_{4n}$  .... (2)  
 $R^{2}$ ,  $(R^{1} O)_{3-1}$  SiRSi  $(OR^{1})_{3-1}$   $R^{2}$ ;  
.... (3)

〔一般式(2)~(3)中、R'およびR'は、同一で も異なっていても良く、それぞれ1価の有機基、Rは2 価の有機基を示し、nは0~2の整数、sおよびtは0 ~1の整数である。〕

# (D) アルカリ触媒

の存在下に、加水分解・縮合して得られる加水分解縮合

成用組成物(以下「組成物(2)」ともいう)を、基体 に塗布し、加熱することを特徴とする、上記膜の形成方 法(以下「形成方法(2)」ともいう)に関する。

### [0006]

# 【発明の実施の形態】 本発明の膜

本発明の膜は、下記一般式(1)で表される構造からな り、かつ膜密度が 0.5~1.4 g/c m³ である。  $SiOxCyHz \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 

(式中、1.3<x<1.9、0.2<y<8.0、 10 0. 6 < z < 7. 0 c 0 > 3.

一般式(1)においては、x, y, zの数値範囲は、好  $\pm 1.4 < x < 1.9, 0.2 < y < 7.0$ 0. 6 < z < 6. 0、さらに好ましくは1. 5 < x < 1. 9、0. 2<y<6. 0、0. 6<z<5. 0であ る。一般式(1)において、x, y, zを上記の範囲と することによって、本発明の膜が低誘電率、かつ高機械 強度を発現することができる。本発明において、上記 x, y, zの数値は、本発明記載の膜形成用組成物を本 発明記載の方法で塗布および加熱することによって、形 20 成することができる。

【0007】また、本発明の膜の密度は、0.5~1. 4g/cm³、好ましくは0.6~1.4g/cm³、 さらに好ましくは0.6~1.3g/cm³である。膜 密度が 0.5g/cm゚未満では、充分な機械的強度が 得られず、一方、1. 4 g / c m³ を超えると、低誘電 率とならない場合がある。なお、膜密度は、ラザフォー ド後方散乱法と水素前方散乱法の組み合わせによって、 測定した値である。

【0008】本発明の膜の炭素含有量は、通常、1.0 価の有機基を示し、nは0~2の整数、sおよびtは0 30 ×10<sup>21</sup> ~3. 0×10<sup>21</sup> a t m/c m<sup>3</sup>、好ましくは 1. 0×10<sup>21</sup> ~2. 5×10<sup>22</sup> a t m/c m³、さら に好ましくは1. 0×10<sup>21</sup>~2. 0×10<sup>22</sup> a t m/ c m³ である。膜の炭素含有量が 1. 0×10<sup>21</sup> a t m /cm<sup>゜</sup>未満では、膜の吸水性が髙くなる場合があり、 一方、3. 0×10<sup>m</sup> a t m/c m<sup>3</sup> を超えると、充分 な機械的強度が得られない場合がある。なお、膜の炭素 含有量は、ラザフォード後方散乱法と水素前方散乱法の 組み合わせによって、測定した値である。

> 【0009】本発明の膜の膜厚は、通常、3μm以下、 40 好ましくは2.8 $\mu$ m以下、さらに好ましくは2.5 $\mu$ m以下である。膜厚が3. 0 μ mを超えると、割れや剥 がれが生じる場合がある。膜厚は、膜形成用組成物の固 形分濃度および/または本発明記載の各途布方法におけ る各塗布条件を調整することにより、容易に制御するこ とができる。なお、膜厚は、光学式膜厚計 (エリプソメ ーター)により測定される。

【0010】本発明の膜は、BJH法による空孔分布測 定による10 n m以上の空孔が、通常、5%以下、好ま しくは4%以下、さらに好ましくは3%以下である。B 物の重量平均分子量を5万~1,000万となした膜形 50 JH法による空孔分布測定による10nm以上の空孔が

5%を超えると、誘電率特性や機械的強度などの膜特性 の均一性が損なわれる場合があり好ましくない。なお、 BJH法による空孔分布測定とは、多孔質体における窒 素の吸脱着挙動より細孔径を算出する方法である。

【0011】本発明の膜は、電子顕微鏡観察による空孔 径測定による1 n m以上の空孔が、通常、5個/100 nm"以下、好ましくは4個/100nm"以下、さら に好ましくは5個/100nm<sup>2</sup>以下である。電子顕微 鏡観察による空孔径測定による1 n m以上の空孔が、5 個/100 n m を超えると、誘電率特性や機械的強度 などの膜特性の均一性が損なわれる場合があり好ましく ない。なお、電子顕微鏡観察による空孔径測定とは、透 過型電子顕微鏡観察において、任意の観察範囲における 100 n m あたりの直径 1 n m以上の空孔の数を測定 する方法である。

【0012】本発明の膜は、上記(a)~(d)の条件 を満たすことが好ましい。すなわち、本発明の膜におい て、(a)弾性率は、2.5GPa以上、好ましくは 2. 8GPa以上、さらに好ましくは3. 0GPa以上 である。2.5GPa未満では、例えば、半導体用絶縁 膜として使用する場合、成形加工時に充分な膜強度が得 られない場合がある。なお、(a) 弾性率は、連続剛性 測定法により、測定された値である。

【0013】また、本発明の膜において、(b) 凝集破 壊強度は、3.0MPa以上、好ましくは3.5MPa 以上、さらに好ましくは3. OMPa以上である。3. OMPa未満では、例えば、半導体絶縁膜として使用す る場合の成形加工時に充分な膜強度が得られない場合が ある。なお、(b) 凝集破壊強度は、セバスチャン法に よるスタッドブル試験により、測定された値である。

【0014】さらに、本発明の膜において、(c)屈折 率は、1. 40以下、好ましくは1. 39以下、さらに 好ましくは1.38以下である。1.40を超えると、 膜の誘電率が高くなる場合があり好ましくない。なお、

(c) 屈折率は、光学式膜厚計 (エリプソメーター) に より、測定された値である。

【0015】さらに、本発明の膜において、(d) 1% 重量減少温度は、400℃以上、好ましくは425℃以 上である。400℃未満では、例えば、半導体絶縁膜と 解ガスなどが発生する場合があり好ましくない。なお、

(d) 1%重量減少温度は、熱重量分析装置 (TGA) を用いて、窒素雰囲気中、10℃/minの昇温速度で 加熱したときに、重量減少が1%となる温度を測定する ことにより決定した。

【0016】本発明の膜は、例えば、上記組成物(1) を用いた膜の形成方法(1)、あるいは、組成物(2) を用いた膜の形成方法(2)により、製造することがで きる。以下、組成物(1)とその膜の形成方法(1)、 組成物(2)とその膜の形成方法(2)について、順

次、説明する。

【0017】組成物(1)

組成物 (1) においては、膜を形成するベースポリマー として(A)成分(化合物(2)~(3)、その加水分 解物および/またはその縮合物(以下「加水分解物およ び/またはその縮合物」を「加水分解縮合物」ともい う)〕を、また多孔質を形成する材料として (B) 有機 ポリマーを用い、(A)~(B)成分の溶剤として、

(C) 有機溶媒を用いる。かくて、(A)~(C) 成分 10 を含有する組成物(1)を、浸漬またはスピンコート法 などにより、シリルウエハなどの基体に塗布し、加熱に より、(B) 有機ポリマーおよび(C) 有機溶媒の除去 と、(A)成分の熱重縮合を行なうと、(A)成分がガ ラス質または巨大高分子の膜を形成するとともに、

(B) 有機ポリマーの全部または大部分が分解・除去さ れることにより、微細孔が形成される。得られる膜は、 多孔質の低密度膜であり、CMP耐性に優れ、誘電率が 低く、低吸水性のため電気的特性の安定性に優れ、層間 絶縁膜材料を形成することができる。

【0018】ここで、(A)成分における上記加水分解 物とは、上記(A)成分を構成する化合物(2)~

(3) に含まれるR' O-基すべてが加水分解されてい る必要はなく、例えば、1個だけが加水分解されている もの、2個以上が加水分解されているもの、あるいは、 これらの混合物であってもよい。また、(A)成分にお ける上記縮合物は、(A)成分を構成する化合物(2) ~(3)の加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シ ラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一 部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっ 30 ているものの混合物などをも包含した概念である。

【0019】以下、組成物(1)に用いられる(A)~ (C) 成分などについて説明し、次いで、組成物 (1) の調製方法などについて詳述する。

(A) 成分; (A) 成分は、2~4個のR¹O-基を有 する化合物(2)および/または4~6個のR'O-基 を有する化合物(3)を使用する。なお、本発明におい て、化合物(3)を用いることにより、特にCMP耐性 が良好となる。上記一般式 (2)~(3) において、R して使用する場合、半導体装置製造時の加熱により、分  $40^{-1}$   $\sim$   $R^2$  は、同一でも異なっていてもよく、それぞれ 1価の有機基である。この1価の有機基としては、アルキ ル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げ ることができる。ここで、アルキル基としては、メチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、 好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は 鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ 素原子などに置換されていてもよい。また、アリール基 としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル 基、エチルフェニル基などを挙げることができる。

【0020】一般式(2)で表される化合物の具体例と

しては、上記一般式(2)におけるn=0の化合物とし て、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テ トラーnープロポキシシラン、テトラーisoープロポ キシシラン、テトラーnープトキシラン、テトラーse cープトキシシラン、テトラーtertープトキシシラ ン、テトラフェノキシシランなどを挙げることができ

【0021】上記一般式 (2) におけるn=1の化合物 の具体例としては、メチルトリメトキシシラン、メチル トリエトキシシラン、メチルトリーnープロポキシシラ ン、メチルトリーisoープロポキシシラン、メチルト リーnープトキシシラン、メチルトリーsecープトキ シシラン、メチルトリーtertープトキシシラン、メ チルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラ ン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロ ポキシシラン、エチルトリーiso-プロポキシシラ ン、エチルトリーnープトキシシラン、エチルトリーs ecープトキシシラン、エチルトリーtertープトキ シシラン、エチルトリフェノキシシラン、nープロピル トリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラ ン、n-プロピルトリーn-プロポキシシラン、n-プ ロピルトリーisoープロポキシシラン、nープロピル トリーnーブトキシシラン、nープロピルトリーsec ープトキシシラン、nープロピルトリーtertープト キシシラン、nープロピルトリフェノキシシラン、iー プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキ シシラン、iープロピルトリーnープロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、iープロピルトリー secープトキシシラン、iープロピルトリーtert ーブトキシシラン、iープロピルトリフェノキシシラ ン、nーブチルトリメトキシシラン、nーブチルトリエ トキシシラン、n-ブチルトリ-n-プロポキシシラ ン、nープチルトリーisoープロポキシシラン、nー ブチルトリー n ーブトキシシラン、n ーブチルトリーs ecーブトキシシラン、nーブチルトリーtertーブ トキシシラン、nーブチルトリフェノキシシラン、se cーブチルトリメトキシシラン、secーブチルーiー ドリエトキシシラン、sec-ブチルートリーn-プロ キシシラン、secーブチルートリーnープトキシシラ ン、secーブチルートリーsecーブトキシシラン、 sec-ブチルートリーtert-ブトキシシラン、s ecーブチルートリフェノキシシラン、tーブチルトリ メトキシシラン、t-ブチルトリエトキシシラン、t-ブチルトリーnープロポキシシラン、tーブチルトリー isoープロポキシシラン、tーブチルトリーnーブト キシシラン、tーブチルトリーsecーブトキシシラ ン、tーブチルトリーtertーブトキシシラン、tー ブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシ 50 シシラン、ジーtert-ブチルージーn-ブトキシシ

ラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーn ープロポキシシラン、フェニルトリーisoープロポキ シシラン、フェニルトリーnーブトキシシラン、フェニ ルトリーsec-ブトキシシラン、フェニルトリーte rtープトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン などを挙げることができる。

8

【0022】上記一般式(2)におけるn=2の化合物 の具体例としては、ジメチルジメトキシシラン、ジメチ ルジエトキシシラン、ジメチルージーn-プロポキシシ 10 ラン、ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメ チルージーnーブトキシシラン、ジメチルージーsec ープトキシシラン、ジメチルージーtertープトキシ シラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメト キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージ -n-プロポキシシラン、ジエチルージーiso-プロ ポキシシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジ エチルージーsecープトキシシラン、ジエチルージー tertープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラ ン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロ 20 ピルジエトキシシラン、ジーn-プロピルージーn-プ ロポキシシラン、ジーnープロピルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシ ラン、ジーn-プロピルージーsec-ブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーtertーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーフェノキシシラン、ジーi so-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピ ルジエトキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-プロポキシシラン、ジーisoープロピルージーiso ープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーnー 30 プトキシシラン、ジーiso-プロピルージーsec-ブトキシシラン、ジーiso-プロピルージーtert ープトキシシラン、ジーisoープロピルージーフェノ キシシラン、ジーnープチルジメトキシシラン、ジーn -ブチルジエトキシシラン、ジ-n-ブチル-ジ-n-プロポキシシラン、ジーnーブチルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnーブチルージーnーブトキシシラ ン、ジーnープチルージーsecーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージーtert-ブトキシシラン、ジーn ープチルージーフェノキシシラン、ジーsecープチル ポキシシラン、secーブチルートリーisoープロポ 40 ジメトキシシラン、ジーsecーブチルジエトキシシラ ン、ジーsecーブチルージーnープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーisoープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーs ecーブチルージーsecーブトキシシラン、ジーse cープチルージーtertープトキシシラン、ジーse c-ブチルージーフェノキシシラン、ジーtertーブ チルジメトキシシラン、ジーtertーブチルジエトキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープロポキシ シラン、ジーtertーブチルージーisoープロポキ

ラン、ジーtertーブチルージーsecーブトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシ シラン、ジーtertープチルージーフェノキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエ トキシシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラ ン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジフ ェニルージーnープトキシシラン、ジフェニルージーs ecーブトキシシラン、ジフェニルージーtertーブ トキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、γーグ 「リシドキシプロピルトリメトキシシラン、ァーグリシド キシプロピルトリエトキシシランなどを挙げることがで きる。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用し ても良い。

【0023】上記一般式(2)で表される化合物の中で は、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシランなど のテトラアルコキシシラン、メチルトリメトキシシラ ン、メチルトリエトキシシランなどのアルキルトリアル コキシシラン、ジメチルジェトキシシラン、ジメチルジ メトキシシランなどのジアルキルジアルコキシシランが 好ましい。

【0024】本発明の組成物(1)において、上記一般 式(2)で表される化合物は2種以上組み合わせて使用 することが好ましく、特にn=0の化合物およびn=1 の化合物を併用することが耐熱性、誘電特性、機械特性 の点で特に好ましい。本発明において、上記一般式

(2) におけるn=0の化合物/上記一般式(2) にお けるn=1の化合物/上記一般式(2)におけるn=2の化合物の使用割合は、10~70/100~0/0~ 30 (重量%) が好ましい。

【0025】一方、上記一般式(3)において、Rは、 2価の有機基を示し、sおよびtは0~1の整数を示 す。ここで、上記一般式(3)において、2価の有機基 としては、アルキレン基、アリーレン基などを挙げるこ とができる。ここで、アルキレン基としては、メチレン 基、エチレン基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~ 2であり、さらに水素原子がフッ素原子などに置換され ていてもよい。また、一般式 (3) において、アリーレ ン基としては、フェニレン基、ナフタレン基などを挙げ ることができる。

【0026】一般式(3)で表される化合物の具体例と しては、ビス(トリメトキシシリル)メタン、ビス(ト リエトキシシリル) メタン、ビス (トリーnープロポキ シシリル)メタン、ビス(トリーiープロポキシシリ ル) メタン、ビス (トリーn-プトキシシリル) メタ ン、ビス (トリーsecーブトキシシリル) メタン、ビ ス (トリー t ープトキシシリル) メタンなどのビス (ト リアルコキシシリル) メタン類;

【0027】1,2-ビス(トリメトキシシリル)エタ ン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリーn-プロポキシシリル)エタン、1、

2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) エタン、1. 2-ビス (トリーn-ブトキシシリル) エタン、1, 2 ービス (トリーsecープトキシシリル) エタン、1, 2-ビス (トリー t - ブトキシシリル) エタンなどの 1, 2-ビス (トリアルコキシシリル) エタン類: 【0028】1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメトキシシリル) メタン、1-(ジエトキシメチ ルシリル) -1- (トリエトキシシリル) メタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル) -1- (トリーn 10 -プロポキシシリル) メタン、1-(ジーi-プロポキ シメチルシリル) -1- (トリーi-プロポキシシリ ル) メタン、1-(ジ-n-プトキシメチルシリル) -1- (トリーnープトキシシリル) メタン、1- (ジー sec-ブトキシメチルシリル) -1- (トリーsec ープトキシシリル) メタン、1-- (ジーtープトキシメ チルシリル) -1- (トリーt-ブトキシシリル) メタ ンなどの1-(ジアルコキシメチルシリル)-1-(ト リアルコキシシリル)メタン類;

【0029】1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチ ルシリル) -2- (トリエトキシシリル) エタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル)-2-(トリ-n ープロポキシシリル) エタン、1 - (ジーi - プロポキ シメチルシリル) -2- (トリーi-プロポキシシリ ル)エタン、1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-2- (トリーn-プトキシシリル) エタン、1- (ジー secープトキシメチルシリル) -2- (トリーsec ープトキシシリル) エタン、1- (ジーtープトキシメ チルシリル) -2- (トリーt-プトキシシリル) エタ 30 ンなどの1-(ジアルコキシメチルシリル)-2-(ト リアルコキシシリル) エタン類;

【0030】ビス(ジメトキシメチルシリル)メタン、

ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーn ープロポキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーiープ ロポキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーnーブトキ シメチルシリル)メタン、ビス(ジーsecープトキシ メチルシリル) メタン、ビス (ジーtーブトキシメチル シリル) メタンなどのビス (ジアルコキシメチルシリ ル) メタン類;1,2-ビス(ジメトキシメチルシリ 40 ル) エタン、1, 2-ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジ-n-プロポキシメチルシリ ル) エタン、1, 2-ビス (ジーi-プロポキシメチル シリル) エタン、1, 2-ビス (ジーn-ブトキシメチ ルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジーsec-ブトキ シメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジーtープト キシメチルシリル) エタンなどの1, 2-ビス (ジアル コキシメチルシリル) エタン類;

【0031】1、2ービス(トリメトキシシリル)ベン ゼン、1, 2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、 50 1, 2-ビス (トリーn-プロポキシシリル) ベンゼ

ン、1, 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベン ゼン、1,2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベン ゼン、1,2ービス(トリーsecープトキシシリル) ベンゼン、1, 2-ビス (トリ-t- ブトキシシリル) ベ ンゼン、1, 3-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼ ン、1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、 1, 3ービス(トリーnープロポキシシリル)ベンゼ ン、1, 3-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベン ゼン、1,3-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベン ゼン、1,3-ビス(トリーsec-ブトキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス (トリーt-ブトキシシリル) ベンゼン、1、4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼ ン、1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、 1, 4-ビス (トリーn-プロポキシシリル) ベンゼ ン、1、4-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベン ゼン、1,4-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベン ゼン、1, 4ービス (トリーsecープトキシシリル) ベンゼン、1, 4ービス (トリー t - ブトキシシリル) ベンゼンなどのビス (トリアルコキシシリル) ベンゼン 類;など挙げることができる。これらの化合物(3) は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。 【0032】上記化合物(3)中では、ビス(トリメト キシシリル) メタン、ビス (トリエトキシシリル) メタ ンなどのビス (トリアルコキシシリル) メタン; 1, 2 ービス (トリメトキシシリル) エタン、1、2ービス (トリエトキシシリル) エタンなどの1, 2-ビス (ト リアルコキシシリル) エタン;1-(ジメトキシメチル シリル) -1- (トリメトキシシリル) メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1- (トリエトキシシリ ル) メタンなどの1- (ジアルコキシメチルシリル) -1- (トリアルコキシシリル) メタン; 1- (ジメトキ シメチルシリル) -2- (トリメトキシシリル) エタ ン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリエト キシシリル) エタンなどの1-(ジアルコキシメチルシ リル) -2-(トリアルコキシシリル) エタン;ビス (ジメトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジエトキシ メチルシリル) メタンなどのビス (ジアルコキシメチル シリル) メタン; 1, 2-ビス (ジメトキシメチルシリ ル) エタン、1, 2-ビス (ジエトキシメチルシリル) エタンなどの1, 2-ビス (ジアルコキシメチルシリ ル) エタン; 1, 2-ビス (トリメトキシシリル) ベン ゼン、1, 2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1, 3 ービス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4ービス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリ エトキシシリル) ベンゼンなどのビス (トリアルコキシ シリル) ベンゼン;が好ましく、特にビス (トリメトキ シシリル) メタン、ビス (トリエトキシシリル) メタン などのビス (トリアルコキシシリル) メタン;1,2-

ビス (トリメトキシシリル) エタン、1, 2-ビス (ト 50

リエトキシシリル) エタンなどの1, 2-ビス (トリア ルコキシシリル) エタンが好ましい。

12

【0033】なお、組成物(1)において、化合物

- (2) と化合物(3) を併用する場合には、化合物
- (2) /化合物(3) が100~20/0~80(重量%)が好ましい。組成物(1)において、化合物(3)を用いることにより、特にCMP耐性が良好となる。

を用いることにより、特にCMP耐性が良好となる。
【0034】上記(A)成分を構成する化合物(2)~
(3)を加水分解、縮合させる際に、R'Oーで表され
10 る基1モル当たり、0.25~3モルの水を用いることが好ましく、0.3~2.5モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が0.25~3モルの範囲内の値であれば、塗膜の均一性が低下する恐れが無く、また、加水分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ないためである。(A)成分が、化合物

(2) および/または化合物 (3) の加水分解縮合物である場合には、その分子量は、GPC法による重量平均分子量で $500\sim100$ , 000であることが好ましい。

20 【0035】触媒;なお、(A)成分を構成する化合物 (2)~(3)を加水分解、縮合させる際には、触媒を使用してもよい。この際に使用する触媒としては、金属キレート化合物、有機酸、無機酸、無機塩基などを挙げることができる。

【0036】金属キレート化合物としては、例えば、ト リエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ト リーn-プロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) チ タン、トリーiープロポキシ・モノ(アセチルアセトナ ート) チタン、トリーnープトキシ・モノ (アセチルア 30 セトナート) チタン、トリーsecーブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリー t ープトキシ ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーnープロポ キシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーi-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ -n-ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタ ン、ジーsecーブトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) チタン、ジーt-ブトキシ・ビス (アセチルアセト ナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセ 40 トナート) チタン、モノーnープロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート) チタン、モノーi-プロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnーブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ -sec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノー t - ブトキシ・トリス (アセチルアセト ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーnープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリーi-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーnーブトキ

シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーs e c - ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジーnープロポキシ・ビス (エチルアセト アセテート) チタン、ジー i ープロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジーn-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーsecーブト キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジー t ・ーブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーnープロポキシ・トリス (エチルアセトアセ テート) チタン、モノー i ープロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノーnープトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノーsec -ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノー t ープトキシ・トリス (エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル アセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナー 20 トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テト ト) ビス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) チタンなどのチタンキレート化合物:

【0037】トリエトキシ・モノ(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリーn-プロポキシ・モノ (アセ チルアセトナート) ジルコニウム、トリーiープロポキ シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ -n-ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーsecープトキシ・モノ (アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリー t - ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーn-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジーi-プロポキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジ-n-ブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーt-プトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジ アセトナート) ジルコニウム、モノーi-プロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、モノーsec-ブトキシ・トリス (アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノー t ープトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、トリ -n-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ

14 トアセテート) ジルコニウム、トリーnーブトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーs e c - ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、ジーnープロポキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーi -プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、ジーn-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテ 10 ート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーtーブトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノーn-プロポキシ・トリス (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノーiープロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノー s e c ープトキシ・トリス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノー t ープトキシ・

ラキス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノ

(アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ

ート) ジルコニウム、ビス (アセチルアセトナート) ビ

(アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー

ト) ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物:

トリス (アセチルアセトナート) アルミニウム、トリス

ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス

(エチルアセトアセテート) アルミニウムなどのアルミ ニウムキレート化合物:などを挙げることができる。 【0038】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオ ン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンスルホン酸、ベンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、ベンゼンス ルコニウム、モノーn-プロポキシ・トリス (アセチル 40 ルホン酸、p-トルエンスルホン酸、フタル酸、フマル 酸、クエン酸、酒石酸などを挙げることができる。無機 酸としては、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン 酸などを挙げることができる。

【0039】有機塩基としては、例えば、ピリジン、ピ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ルコニウム、トリーiープロポキシ・モノ(エチルアセ 50 ロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア

ンモニウムハイドロオキサイドなどを挙げることができ る。無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カ ルシウムなどを挙げることができる。

【0040】これら触媒のうち、金属キレート化合物、 有機酸、無機酸が好ましく、さらに好ましくはチタンキ レート化合物、有機酸、特に好ましくは有機酸、特に酸 酢酸、シュウ酸、マレイン酸、マロン酸などがである。 触媒の使用量は、加水分解前の化合物(2)~(3)の ましくは0.001~0.1モルである。

【0041】(B)有機ポリマー;(B)有機ポリマー としては、例えば、ポリエーテル、ポリエステル、ポリ カーボネート、ポリアンハイドライド、および (メタ) アクリル系重合体の群から選ばれた少なくとも1種が挙 げられる。

【0042】このうち、(B)成分を構成するポリエー テルとしては、繰り返し単位中の炭素数が2~12のポ リアルキレングリコール化合物を挙げることができ、例 えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコ ール、ポリトリメチレングリコール、ポリテトラメチレ ングリコール、ポリペンタメチレングリコール、ポリヘ キサメチレングリコール、ポリエチレングリコールーポ リプロピレングリコールプロックコポリマー、ポリエチ レングリコールーポリテトラメチレングリコールプロッ クコポリマー、ポリエチレングリコールーポリプロピレ ングリコールーポリエチレングリコールブロックコポリ マー、およびそのメチルエーテル、エチルエーテル、プ ロピルエーテル、トリメトキシシリルエーテル、トリエ トキシシリルエーテル、トリプロポキシシリルエーテ ル、トリメトキシシリルメチルエーテル、トリエトキシ シリルメチルエーテル、2-トリメトキシシリルエチル エーテル、2-トリエトキシシリルエチルエーテル、3 - トリメトキシシリルプロピルエーテル、3-トリエト キシシリルプロピルエーテルなどのほか、ポリエチレン グリコールモノペンチルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノヘキシルエーテル、ポリエチレングリコールモ ノペプチルエーテル、ポリエチレングリコールモノオク チルエーテル、ポリエチレングリコールモノノニルエー テル、ポリエチレングリコールモノデカニルエーテル、 ポリエチレングリコールモノウンデカニルエーテル、ポ リエチレングリコールモノドデカニルエーテル、ポリエ チレングリコールモノトリデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノテトラデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノペンタデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノヘキサデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノヘプタデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノオクタデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノノナデカニルエーテル、ポリエチレ

リコールモノヘニコサニルエーテル、ポリエチレングリ コールモノドコサニルエーテル、ポリエチレングリコー ルモノトリコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノテトラコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノペンタコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノヘキサコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノヘプタコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノオクタコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノノナコサニルエーテル、ポリエチレングリコールモ 総量1モルに対して、通常、0.0001~1モル、好 10 ノトリアコンタニルエーテルなどのポリエチレングリコ ールアルキルエーテル類およびそのメチルエーテル、エ チルエーテル、プロピルエーテル、トリメトキシシリル エーテル、トリエトキシシリルエーテル、トリプロポキ シシリルエーテル、トリメトキシシリルメチルエーテ ル、トリエトキシシリルメチルエーテル、2-トリメト キシシリルエチルエーテル、2-トリエトキシシリルエ チルエーテル、3-トリメトキシシリルプロピルエーテ ル、3-トリエトキシシリルプロピルエーテルなどのポ リエチレングリコールアルキルエーテル誘導体:

【0043】ポリエチレングリコールモノーローメチル 20 フェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノーpー エチルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノ - p - プロピルフェニルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノーpープチルフェニルエーテル、ポリエチレン グリコールモノーp-ペンチルフェニルエーテル、ポリ エチレングリコールモノ-p-ヘキシルフェニルエーテ ル、ポリエチレングリコールモノ-p-ペプチルフェニ ルエーテル、ポリエチレングリコールモノーpーオクチ ルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノーp 30 ーノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモ ノーpーデカニルフェニルエーテル、ポリエチレングリ コールモノーp-ウンデカニルフェニルエーテル、ポリ エチレングリコールモノー p - ドデカニルフェニルエー テル、ポリエチレングリコールモノーロートリデカニル フェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノーp-テトラデカニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノーpーペンタデカニルフェニルエーテル、ポリ エチレングリコールモノ-p-ヘキサデカニルフェニル エーテル、ポリエチレングリコールモノ-p-ヘプタデ 40 カニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノ -p-オクタデカニルフェニルエーテル、ポリエチレン グリコールモノーp-ノナデカニルフェニルエーテル、 ポリエチレングリコールモノーpーイコサニルフェニル エーテル、ポリエチレングリコールモノーpーヘニコサ ニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノー p-ドコサニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノーpートリコサニルフェニルエーテル、ポリエ チレングリコールモノーpーテトラコサニルフェニルエ ーテルなどのポリエチレングリコール-p-アルキルフ ングリコールモノイコサニルエーテル、ポリエチレング 50 ェニルエーテル類およびそのメチルエーテル、エチルエ

(10)

ーテル、プロピルエーテル、トリメトキシシリルエーテ ル、トリエトキシシリルエーテル、トリプロポキシシリ ルエーテル、トリメトキシシリルメチルエーテル、トリ エトキシシリルメチルエーテル、2-トリメトキシシリ ルエチルエーテル、2-トリエトキシシリルエチルエー テル、3-トリメトキシシリルプロピルエーテル、3-トリエトキシシリルプロピルエーテルなどのポリエチレ ングリコール-p-アルキルフェニルエーテル誘導体: 【0044】ポリエチレングリコールモノペンタン酸エ ステル、ポリエチレングリコールモノヘキサン酸エステ 10 ル、ポリエチレングリコールモノヘプタン酸エステル、 ポリエチレングリコールモノオクタン酸エステル、ポリ エチレングリコールモノノナン酸エステル、ポリエチレ ングリコールモノデカン酸エステル、ポリエチレングリ コールモノウンデカン酸エステル、ポリエチレングリコ ールモノドデカン酸エステル、ポリエチレングリコール モノトリデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノテトラデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノペンタデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノヘプタデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノオクタデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノノナデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモノ イコサン酸エステル、ポリエチレングリコールモノヘニ コサン酸エステル、ポリエチレングリコールモノドコサ ン酸エステル、ポリエチレングリコールモノトリコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノテトラコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノペンタコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノヘキサコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノオクタコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノノナコサン酸 エステル、ポリエチレングリコールモノトリアコンタン 酸エステルなどのポリエチレングリコールアルキル酸エ ステル類およびそのメチルエーテル、エチルエーテル、 プロピルエーテル、トリメトキシシリルエーテル、トリ エトキシシリルエーテル、トリプロポキシシリルエーテ ル、トリメトキシシリルメチルエーテル、トリエトキシ シリルメチルエーテル、2-トリメトキシシリルエチル エーテル、2-トリエトキシシリルエチルエーテル、3 - トリメトキシシリルプロピルエーテル、3 - トリエト キシシリルプロピルエーテルなどのポリエチレングリコ ールアルキル酸エステル誘導体などを挙げることができ る。これらのポリエーテルは、1種単独であるいは2種 以上を併用することができる。

【0045】ポリエーテルのGPC法による重量平均分 子量は、通常、300~300,000、好ましくは3 00~200,000、特に好ましくは300~10 0,000である。

【0046】また、(B) 成分を構成するポリエステル 50 ポリエチレンカーボネート、ポリプロピレンカーボネー

としては、炭素数2~12の脂肪族鎖およびエステル結 合を繰り返し単位中に含む化合物を挙げることができ、 例えば、ポリカプロラクトン、ポリピバロラクトン、ポ リエチレンオキサレート、ポリエチレンマロネート、ポ リエチレンスクシネート、ポリエチレングリタレート、 ポリエチレンアジペート、ポリエチレンピメレート、ポ リエチレンスベレート、ポリエチレンアゼラート、ポリ エチレンセバケート、ポリプロピレンオキサレート、ポ リプロピレンマロネート、ポリプロピレンスクシネー ト、ポリプロピレングリタレート、ポリプロピレンアジ ペート、ポリプロピレンピメレート、ポリプロピレンス ベレート、ポリプロピレンアゼラート、ポリプロピレン セバケート、ポリブチレンオキサレート、ポリブチレン マロネート、ポリブチレンスクシネート、ポリブチレン グリタレート、ポリブチレンアジペート、ポリブチレン ピメレート、ポリブチレンスベレート、ポリブチレンア ゼラート、ポリブチレンセパケート、ポリオキシジェチ レンオキサレート、ポリオキシジエチレンマロネート、 ポリオキシジエチレンスクシネート、ポリオキシジエチ ノヘキサデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ 20 レングリタレート、ポリオキシジエチレンアジペート、 ポリオキシジエチレンピメレート、ポリオキシジエチレ ンスベレート、ポリオキシジエチレンアゼラート、ポリ オキシジエチレンセバケートなどの脂肪族ポリエステル 類、およびそのメチルエーテル、エチルエーテル、プロ ピルエーテル、トリメトキシシリルエーテル、トリエト キシシリルエーテル、トリプロポキシシリルエーテル、 トリメトキシシリルメチルエーテル、トリエトキシシリ ルメチルエーテル、2-トリメトキシシリルエチルエー テル、2-トリエトキシシリルエチルエーテル、3-ト 酸エステル、ポリエチレングリコールモノヘプタコサン 30 リメトキシシリルプロピルエーテル、3-トリエトキシ シリルプロピルエーテル、メチルエステル、エチルエス テル、プロピルエステル、トリメトキシシリルエステ ル、トリエトキシシリルエステル、トリプロポキシシリ ルエステル、トリメトキシシリルメチルエステル、トリ エトキシシリルメチルエステル、2-トリメトキシシリ ルエチルエステル、2-トリエトキシシリルエチルエス テル、3-トリメトキシシリルプロピルエステル、3-トリエトキシシリルプロピルエステルなどの脂肪族ポリ エステルアルキルエーテル誘導体及び脂肪族ポリエステ 40 ルアルキルエステル誘導体が挙げられる。これらのポリ エステルは、1種単独であるいは2種以上を併用するこ とができる。

> 【0047】ポリエステルのGPC法による重量平均分 子量は、通常、300~300,000、好ましくは3 00~200,000、特に好ましくは300~10 0,000である。

> 【0048】さらに、(B)成分を構成するポリカーボ ネートとしては、繰り返し単位中の炭素数が2~12の 脂肪族ポリカーボネートを挙げることができ、例えば、

ト、ポリトリメチレンカーボネート、ポリテトラメチレ ンカーボネート、ポリペンタメチレンカーボネート、ポ リヘキサメチレンカーボネート、ポリヘプタメチレンカ ーボネート、ポリオクタメチレンカーボネート、ポリノ ナメチレンカーボネート、ポリデカメチレンカーボネー ト、ポリオキシジエチレンカーボネート、ポリー3.6 ージオキシオクタンカーボネート、ポリー3,6,9-トリオキシウンデカンカーボネート、ポリオキシジプロ ピレンカーボネート、ポリシクロペンタンカーボネー ト、ポリシクロヘキサンカーボネートなどの脂肪族ポリ カーボネート、およびそのメチルエステル、エチルエス テル、プロピルエステル、トリメトキシシリルエステ ル、トリエトキシシリルエステル、トリプロポキシシリ ルエステル、トリメトキシシリルメチルエステル、トリ エトキシシリルメチルエステル、2-トリメトキシシリ ルエチルエステル、2-トリエトキシシリルエチルエス テル、3-トリメトキシシリルプロピルエステル、3-トリエトキシシリルプロピルエステルなどの脂肪族ポリ カーボネートアルキルエステル誘導体が挙げられる。こ 上を併用することができる。

【0049】ポリカーボネートのGPC法による重量平 均分子量は、通常、300~300,000、好ましく は300~200,000、特に好ましくは300~1 00,000である。

【0050】さらに、(B) 成分を構成するポリアンハ イドライドとしては、炭素数2~12の脂肪族ジカルボ ン酸から得られるポリアンハイドライドが挙げられ、例 えば、ポリオキサリックアンハイドライド、ポリマロニ ックアンハイドライド、ポリスクシニックアンハイドラ イド、ポリグルタリックアンハイドライド、ポリアジピ ックアンハイドライド、ポリピメリックアンハイドライ ド、ポリスベリックアンハイドライド、ポリアゼライッ クアンハイドライド、ポリセバシックアンハイドライド などの脂肪族ポリアンハイドライド、およびそのメチル エステル、エチルエステル、プロピルエステル、トリメ トキシシリルエステル、トリエトキシシリルエステル、 トリプロポキシシリルエステル、トリメトキシシリルメ チルエステル、トリエトキシシリルメチルエステル、2 シシリルエチルエステル、3-トリメトキシシリルプロ ピルエステル、3-トリエトキシシリルプロピルエステ ルなどの脂肪族ポリアンハイドライドアルキルエステル 誘導体などが挙げられる。これらのポリアンハイドライ ドは、1種単独であるいは2種以上を併用することがで きる。

【0051】ポリアンハイドライドのGPC法による重 量平均分子量は、通常、300~300、000、好ま しくは300~200,000、特に好ましくは300 ~100,000である。

【0052】さらに、(B) 成分を構成する (メタ) ア クリル系重合体としては、ポリオキシエチル基、ポリオ キシプロピル基、アミド基、ヒドロキシル基、カルボキ シル基の群より選ばれた少なくとも1種を有する(メ タ) アクリル系重合体が挙げられる。上記 (メタ) アク リル系重合体は、アクリル酸、メタクリル酸、上記官能 基を有するアクリル酸誘導体、上記官能基を有するメタ クリル酸誘導体、上記官能基を有さないアクリル酸エス テルおよび上記官能基を有さないメタクリル酸エステル 10 より構成される。

【0053】上記官能基を有するアクリル酸誘導体の具 体例としては、2-ヒドロキシエチルアクリレート、ジ エチレングリコールアクリレート、ポリエチレングリコ ールアクリレート、メトキシジエチレングリコールアク リレート、メトキシポリエチレングリコールアクリレー ト、エトキシジエチレングリコールアクリレート、エト キシポリエチレングリコールアクリレート、2-ヒドロ キシプロピルアクリレート、ジプロピレングリコールア クリレート、ポリプロピレングリコールアクリレート、 れらのポリカーボネートは、1種単独であるいは2種以 20 メトキシジプロピレングリコールアクリレート、メトキ シポリプロピレングリコールアクリレート、エトキシジ プロピレングリコールアクリレート、エトキシポリプロ ピレングリコールアクリレート、2-ジメチルアミノエ チルアクリレート、2-ジエチルアミノエチルアクリレ ート、Nービニルピロリドン、ビニルピリジン、アクリ ルアミド、N-メチルアクリルアミド、N, N-ジメチ ルアクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、グ リシジルアクリレートなどのモノアクリレート類;ジエ チレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコ 30 ールジアクリレートなどのジアクリレート類:などが挙 げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用 してもよい。

【0054】上記官能基を有するメタクリル酸誘導体の 具体例としては、2-ヒドロキシエチルメタクリレー ト、ジエチレングリコールメタクリレート、ポリエチレ ングリコールメタクリレート、メトキシジエチレングリ コールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコー ルメタクリレート、エトキシジエチレングリコールメタ クリレート、エトキシポリエチレングリコールメダクリ ートリメトキシシリルエチルエステル、2ートリエトキ 40 レート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、ジプ ロピレングリコールメタクリレート、ポリプロピレング リコールメタクリレート、メトキシジプロピレングリコ ールメタクリレート、メトキシポリプロピレングリコー ルメタクリレート、エトキシジプロピレングリコールメ タクリレート、エトキシポリプロピレングリコールメタ クリレート、2ージメチルアミノエチルメタクリレー ト、2-ジエチルアミノエチルメタクリレート、メタク リルアミド、N-メチルメタクリルアミド、N. N-ジ メチルメタクリルアミド、Nーメチロールメタクリルア 50 ミド、グリシジルメタクリレートなどのモノメタクリレ

ート類;ジエチレングリコールジメタクリレート、ポリ エチレングリコールジメタクリレート、ジプロピレング リコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコール ジメタクリレートなどのジメタクリレート類;などが挙 げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用 してもよい。

21

【0055】上記官能基を有さないアクリル酸エステル の具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリ レート、nープロピルアクリレート、isoープロピル ルアクリレート、secープチルアクリレート、ter ーブチルアクリレート、アミルアクリレート、ヘキシル アクリレート、ヘプチルアクリレート、オクチルアクリ レート、ノニルアクリレート、デシルアクリレート、ド デシルアクリレート、テトラデシルアクリレート、ヘキ サデシルアクリレート、オクタデシルアクリレート、シ クロヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリ レート、2-メトキシエチルアクリレート、2-エトキ シエチルアクリレート、2-メトキシプロピルアクリレ クリレート、フェニルカルビトールアクリレート、ノニ ルフェニルアクリレート、ノニルフェニルカルビトール アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリ レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボ ルニルアクリレートなどのモノアクリレート類;エチレ ングリコールジアクリレート、1,3-ブチレングリコ ールジアクリレート、1,4-ブチレングリコールジア クリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、 1, 6-ヘキサングリコールジアクリレート、2, 2-ビス (4-アクリロキシプロピロキシフェニル) プロパ ン、2, 2-ビス(4-アクリロキシジエトキシフェニ ル) プロパンなどのジアクリレート類;トリメチロール エタントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート などのトリアクリレート類;ペンタエリスリトールテト ラアクリレートなどのテトラアクリレート類などが挙げ られる。これらは、1種または2種以上を同時に使用し てもよい。

【0056】上記官能基を有さないメタクリル酸エステ ルの具体例としては、メチルメタクリレート、エチルメ タクリレート、n-プロピルメタクリレート、iso-プロピルメタクリレート、nーブチルメタクリレート、 iso-ブチルメタクリレート、sec-ブチルメタク リレート、terーブチルメタクリレート、アミルメタ クリレート、ヘキシルメタクリレート、ヘプチルメタク リレート、オクチルメタクリレート、ノニルメタクリレ ート、デシルメタクリレート、ドデシルメタクリレー ト、テトラデシルメタクリレート、ヘキサデシルメタク リレート、オクタデシルメタクリレート、シクロヘキシ ルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレー

ト、2-メトキシエチルメタクリレート、2-エトキシ エチルメタクリレート、2-メトキシプロピルメタクリ レート、2-エトキシプロピルメタクリレート、ベンジ ルメタクリレート、フェニルカルビトールメタクリレー ト、ノニルフェニルメタクリレート、ノニルフェニルカ ルビトールメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシ エチルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタク リレート、イソボルニルメタクリレートなどのモノメタ クリレート類;エチレングリコールジメタクリレート、 アクリレート、n-ブチルアクリレート、iso-ブチ 10 1,3-ブチレングリコールジメタクリレート、1,4 ーブチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチル グリコールジメタクリレート、1,6-ヘキサングリコ ールジメタクリレート、2,2ービス(4ーメタクリロ キシジエトキシフェニル) プロパンなどのジメタクリレ ート類:トリメチロールエタントリエタクリレート、ト リメチロールプロパントリメタクリレートなどのトリメ タクリレート類などが挙げられる。これらは、1種また は2種以上を同時に使用してもよい。

【0057】本発明において、ポリオキシエチル基、ポ ート、2-エトキシプロピルアクリレート、ベンジルア 20 リオキシプロピル基、アミド基、ヒドロキシル基、カル ボキシル基、グリシジル基の群より選ばれた少なくとも 1種を有する(メタ)アクリル系重合体は、アクリル 酸、メタクリル酸、上記官能基を有するアクリル酸誘導 体および上記官能基を有するメタクリル酸誘導体を、上 記 (メタ) アクリレート系重合体を構成する全モノマー に対して、通常、5モル%以上、好ましくは10モル% 以上、特に好ましくは20モル%以上含む。アクリル 酸、メタクリル酸、上記官能基を有するアクリル酸誘導 体および上記官能基を有するメタクリル酸誘導体が5モ 30 ル%未満の場合は得られる硬化物塗膜中の空隙のサイズ が大きくなり微細配線間の層間絶縁膜材料として好まし くない。

> 【0058】本発明において、(メタ)アクリレート系 重合体は、上記アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸 誘導体およびメタクリル酸誘導体以外のラジカル重合性 モノマーを40モル%以下共重合していてもよい。ラジ カル重合性モノマーとしては、アクリロニトリルなどの 不飽和ニトリル、メチルビニルケトンなどの不飽和ケト ン、スチレン、αーメチルスチレンなどの芳香族化合物 40 などを挙げることができる。

【0059】本発明において、(メタ)アクリル系重合 体のGPC法による平均分子量は、1,000~20 0,000、好ましくは1,000~50,000であ る。以上の(B)有機ポリマーは、1種あるいは2種以 上を混合して使用することができる。

【0060】本発明において、上記(B)有機ポリマー を用いることで、得られる塗膜の密度を低下させ、低誘 電率を達成することができ、半導体素子などにおける層 間絶縁膜として有用である。(B)有機ポリマーの使用 50 量は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)100重

量部に対し、通常、1~80重量部、好ましくは5~6 5重量部である。1重量部未満では、誘電率を下げる効 果が小さく、一方、80 重量部を超えると、機械的強度 が低下する。なお、本発明において、完全加水分解縮合 %加水分解してSiOH基となり、さらに完全に縮合し てシロキサン構造になったものをいう。

【0061】(C)有機溶媒;本発明では、通常、上記 (A)~(B)成分が(C)有機溶媒に溶解されてい る。本発明で使用される(C)有機溶媒としては、例え ば、n-ペンタン、i-ペンタン、n-ヘキサン、i-ヘキサン、n-ヘプタン、i-ヘプタン、2, 2, 4-トリメチルペンタン、n-オクタン、i-オクタン、シ クロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化 水素系溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベ ンゼン、トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、 n-プロピルベンセン、i-プロピルベンセン、ジエチ ルベンゼン、i-ブチルベンゼン、トリエチルベンゼ ン、ジーiープロピルベンセン、nーアミルナフタレ ン、トリメチルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒: メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロ パノール、nーブタノール、iーブタノール、sec-ブタノール、tーブタノール、nーペンタノール、i-ペンタノール、2-メチルブタノール、sec-ペンタ ノール、t-ペンタノール、3-メトキシブタノール、 n-ヘキサノール、2-メチルペンタノール、sec-ヘキサノール、2-エチルブタノール、sec-ヘプタ ノール、ヘプタノール-3、n-オクタノール、2-エ チルヘキサノール、secーオクタノール、nーノニル デカノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチ ルノニルアルコール、sec-テトラデシルアルコー ル、secーヘプタデシルアルコール、フェノール、シ クロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール、3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアル コール、フェニルメチルカルビノール、ジアセトンアル コール、クレゾールなどのモノアルコール系溶媒:エチ レングリコール、1,2-プロピレングリコール、1, 3-ブチレングリコール、ペンタンジオール-2.4、 2-メチルペンタンジオール-2, 4、ヘキサンジオー ルー2、5、ヘプタンジオールー2、4、2-エチルへ キサンジオールー1,3、ジエチレングリコール、ジプ ロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプ ロピレングリコール、グリセリンなどの多価アルコール 系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン、メチルーn-プロピルケトン、メチルーnープチルケトン、ジエチル ケトン、メチルーiープチルケトン、メチルーnーペン チルケトン、エチル-n-ブチルケトン、メチル-n-ヘキシルケトン、ジーiーブチルケトン、トリメチルノ ナノン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、

2, 4-ペンタンジオン、アセトニルアセトン、ジアセ トンアルコール、アセトフェノン、フェンチョン、アセ チルアセトン、2、4-ヘキサンジオン、2、4-ヘプ タンジオン、3,5-ヘプタンジオン、2,4-オクタ ンジオン、3,5-オクタンジオン、2,4-ノナンジ オン、3,5-ノナンジオン、5-メチル-2,4-ヘ キサンジオン、2, 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5 −ヘプタンジオン、1, 1, 1, 5, 5, 5 −ヘキサフ ルオロー2, 4-ヘプタンジオンなどのケトン系溶媒; 10 エチルエーテル、i - プロピルエーテル、n - ブチルエ ーテル、n-ヘキシルエーテル、2-エチルヘキシルエ ーテル、エチレンオキシド、1、2-プロピレンオキシ ド、ジオキソラン、4ーメチルジオキソラン、ジオキサ ン、ジメチルジオキサン、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル。 エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコ ールモノーnーブチルエーテル、エチレングリコールモ ノ-n-ヘキシルエーテル、エチレングリコールモノフ ェニルエーテル、エチレングリコールモノー2ーエチル 20 ブチルエーテル、エチレングリコールジブチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチ レングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコ ールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ-n ープチルエーテル、ジエチレングリコールジ-n-ブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノーnーヘキシル エーテル、エトキシトリグリコール、テトラエチレング リコールジーn-ブチルエーテル、プロピレングリコー ルモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチ ルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテ アルコール、2, 6-ジメチルヘプタノール-4、n- 30 ル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロ ピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレング リコールモノエチルエーテル、トリプロピレングリコー ルモノメチルエーテル、テトラヒドロフラン、2-メチ ルテトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒:ジエチル カーボネート、酢酸メチル、酢酸エチル、γープチロラ クトン、γーバレロラクトン、酢酸nープロピル、酢酸 i-プロピル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、酢酸 sec-ブチル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペン チル、酢酸3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、 酢酸2-エチルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸 ベンジル、酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキ シル、酢酸n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸 エチル、酢酸エチレングリコールモノメチルエーテル 酢酸エチレングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコ ールモノーnーブチルエーテル、酢酸プロピレングリコ ールモノメチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモ ノエチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロ 50 ピルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエ

ーテル、酢酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテ ル、酢酸ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジ酢酸グリコール、酢酸メトキシトリグリコール、プロ ピオン酸エチル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン 酸iーアミル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーnーブ チル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸 n-アミル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フ タル酸ジエチルなどのエステル系溶媒; N-メチルホル ムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジ エチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセト アミド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチルプ ロピオンアミド、Nーメチルピロリドンなどの含窒素系 溶媒;硫化ジメチル、硫化ジエチル、チオフェン、テト ラヒドロチオフェン、ジメチルスルホキシド、スルホラ ン、1、3-プロパンスルトンなどの含硫黄系溶媒等を 挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を 混合して使用することができる。

【0062】本発明において、有機溶媒として、沸点が 250℃未満の有機溶媒を用いることが好ましく、具体 的にはメタノール、エタノール、イソプロパノールなど 20 のアルコール、エチレングリコール、グリセリンなどの 多価アルコール、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレ ングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコー ルジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチル エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、 プロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピ レングリコールモノエチルエーテルなどのグリコールエ ーテル溶媒、エチレングリコールモノメチルアセテー ト. ジェチレングリコールモノブチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールジアセテート、プロピレングリ コールメチルエーテルアセテートなどのグリコールアセ テートエーテル溶媒、N、Nージメチルアセトアミド、 N、N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロ リドンなどのアミド系溶媒、アセトン、メチルエチルケ トン、メチルイソブチルケトン、アセチルアセトン、メ チルアミルケトンなどのケトン系溶媒、乳酸エチル、メ トキシメチルプロピオネート、エトキシエチルプロピオ ネートなどのカルボン酸エステル系溶媒等の1種単独ま たは2種以上の組み合わせを挙げることができる。本発 40 明において、(C)有機溶媒の使用量は、(A)~

(B) 成分の総和量の 0. 3~25倍量(重量)の範囲である。

【0063】本発明の組成物(1)は、上記(A)~(C)成分以外に、必要に応じて他の成分を混合することができる。他の成分としては、界面活性剤、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナなどの充填剤を挙げることができる。また、組成物(1)を構成するにあたり、組成物中の沸点100℃以下のアルコールの含量が、20重量%以下、特に5重量%以下であることが好まし

い。沸点100℃以下のアルコールは、上記(A)成分の加水分解・縮合反応の際に生じる場合があり、その含量が20重量%以下、好ましくは5重量%以下になるように蒸留などにより除去することが好ましい。

【0064】組成物(1)の調製方法;本発明の組成物

- (1) の調製方法の具体例としては、下記(1)~
- (4) の方法などを挙げることができる。

(14)

- (1) (A) 成分を構成する化合物(2) および/または(3)、触媒ならびに(C) 有機溶媒からなる混合物10 に、所定量の水を加えて加水分解・縮合反応を行ったのち、(B) 有機ポリマーを混合する。
  - (2) (A) 成分を構成する化合物 (2) および/または (3) 、触媒ならびに (C) 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行なったのち、(B) 有機ポリマーを混合する。
  - (3) (A) 成分を構成する化合物 (2) および/または (3)、触媒、(B) 有機ポリマーならびに(C) 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を加えて加水分解・縮合反応を行なう。
  - (4) (A) 成分を構成する化合物(2) および/または(3)、触媒、(B) 有機ポリマーおよび(C) 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行なう。

【0065】このようにして得られる本発明の組成物

(1)の全固形分濃度は、好ましくは、2~50重量%、好ましくは2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~50重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上記有機溶媒による希釈によって行われる。

【0066】組成物(1)を用いた膜の形成方法(1)本発明の組成物(1)を用いて膜を形成するには、まず本発明の組成物(1)を基板に塗布し、塗膜を形成する。ここで、本発明の組成物(1)を塗布することができる基板としては半導体、ガラス、セラミックス、金属などが挙げられ、塗布方法としてはスピンコート、ディッピング、ローラーブレードなどが挙げられる。本発明の組成物(1)は、特にシリコンウエハ、SiO。ウエハ、SiNウエハなどの上に塗布され、絶縁膜とすることに適している。

【0067】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、0.1 ~3μm程度の塗膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することができ、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。この加熱方法としては、形成した塗膜を上記(B)有機50 ポリマーの分解温度未満の温度で加熱して、(A)成分

を一部硬化させ、次いで上記(B)有機ポリマーの分解 温度以上の温度から最終硬化温度まで加熱し、低密度の 硬化物とする方法などが挙げられる。また、上記の

(A) 成分の硬化速度と(B) 有機ポリマーの分解速度 を制御するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、 窒素、空気、酸素、減圧などの雰囲気を選択することが できる。通常、(B) 有機ポリマーの分解温度は250 ~450℃であるので、塗膜は最終的にはこの温度以上 に加熱される工程を含む。この工程は、減圧状態もしく は不活性ガス下で行われるのが好ましい。

# 【0068】組成物(2)

本発明の組成物(2)は、膜を形成するベースポリマー として、(A)成分(化合物(2)および化合物(3) の群から選ばれた少なくとも1種〕を、(D) アルカリ 触媒の存在下に、加水分解、縮合することにより、重量 平均分子量を5万~1,000万となした加水分解縮合 物(加水分解物および/またはその縮合物)を用いた、 ポリオルガノシロキサン系組成物である。この本発明の 組成物を、浸漬またはスピンコート法などにより、シリ コンウエハなどの基材に塗布し、加熱により、(A)成 20 分の熱重縮合を行なうと、(A)成分がガラス質または 巨大高分子の膜を形成し、得られる膜は、低誘電率で、 かつ高弾性率のため機械的強度に優れ、層間絶縁膜材料 を形成することができる。ここで、組成物 (2) に用い られる(A)成分(化合物(2)や化合物(3))につ いては、組成物(1)に用いられる化合物(2)~ (3) と同様であるので、省略する。

【0069】(D)アルカリ触媒;本発明では、上記 (A) 成分を構成する化合物(2)~(3) の群から選 ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合 させる際に、アルカリ触媒を用いる。アルカリ触媒とし ては、無機塩基のほか、有機塩基などが挙げられる。こ こで、無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化 カルシウムなどを挙げることができる。また、有機塩基 としては、例えば、メタノールアミン、エタノールアミ ン、プロパノールアミン、ブタノールアミン、Nーメチ ルメタノールアミン、N-エチルメタノールアミン、N -プロピルメタノールアミン、N-ブチルメタノールア ミン、N-メチルエタノールアミン、N-エチルエタノ ールアミン、Nープロピルエタノールアミン、Nーブチ ルエタノールアミン、Nーメチルプロパノールアミン、 N-エチルプロパノールアミン、N-プロピルプロパノ ールアミン、Nーブチルプロパノールアミン、Nーメチ ルブタノールアミン、N-エチルブタノールアミン、N -プロピルブタノールアミン、N-ブチルブタノールア ミン、N, N-ジメチルメタノールアミン、N, N-ジ エチルメタノールアミン、N, N-ジプロピルメタノー ルアミン、N, N-ジブチルメタノールアミン、N, N -ジメチルエタノールアミン、N, N-ジエチルエタノ 50 プロピルアミン、メチルアミノブチルアミン、エチルア

ールアミン、N, N-ジプロピルエタノールアミン、 N, N-ジブチルエタノールアミン、N, N-ジメチル プロパノールアミン、N, N-ジエチルプロパノールア ミン、N, N-ジプロピルプロパノールアミン、N, N -ジブチルプロパノールアミン、N, N-ジメチルブタ ノールアミン、N, N-ジエチルブタノールアミン、 N, N-ジプロピルブタノールアミン、N, N-ジブチ ルプタノールアミン、N-メチルジメタノールアミン、 N-エチルジメタノールアミン、N-プロピルジメタノ 10 ールアミン、N-ブチルジメタノールアミン、N-メチ ルジエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミ ン、N-プロピルジエタノールアミン、N-ブチルジエ タノールアミン、Nーメチルジプロパノールアミン、N -エチルジプロパノールアミン、N-プロピルジプロパ ノールアミン、N-ブチルジプロパノールアミン、N-メチルジブタノールアミン、N-エチルジブタノールア ミン、Nープロピルジブタノールアミン、Nープチルジ ブタノールアミン、N- (アミノメチル) メタノールア ミン、N-(アミノメチル) エタノールアミン、N-(アミノメチル) プロパノールアミン、N-(アミノメ チル) ブタノールアミン、N-(アミノエチル) メタノ ールアミン、N-(アミノエチル)エタノールアミン、 N- (アミノエチル) プロパノールアミン、N- (アミ ノエチル) ブタノールアミン、N-(アミノプロピル) メタノールアミン、N-(アミノプロピル) エタノール アミン、N-(アミノプロピル)プロパノールアミン、 N- (アミノプロピル) ブタノールアミン、N- (アミ ノブチル) メタノールアミン、N- (アミノブチル) エ タノールアミン、N- (アミノブチル) プロパノールア 30 ミン、N-(アミノブチル) ブタノールアミン、メトキ シメチルアミン、メトキシエチルアミン、メトキシプロ ピルアミン、メトキシブチルアミン、エトキシメチルア ミン、エトキシエチルアミン、エトキシプロピルアミ ン、エトキシブチルアミン、プロポキシメチルアミン、 プロポキシエチルアミン、プロポキシプロビルアミン、 プロポキシブチルアミン、ブトキシメチルアミン、ブト キシエチルアミン、ブトキシプロピルアミン、ブトキシ ブチルアミン、メチルアミン、エチルアミン、プロピル アミン、ブチルアミン、N, N-ジメチルアミン、N, 40 N-ジエチルアミン、N, N-ジプロピルアミン、N, N-ジブチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルア ミン、トリプロピルアミン、トリプチルアミン、テトラ メチルアンモニウムハイドロキサイド、テトラエチルア ンモニウムハイドロキサイド、テトラプロピルアンモニ ウムハイドロキサイド、テトラブチルアンモニウムハイ ドロキサイド、テトラメチルエチレンジアミン、テトラ エチルエチレンジアミン、テトラプロピルエチレンジア ミン、テトラブチルエチレンジアミン、メチルアミノメ チルアミン、メチルアミノエチルアミン、メチルアミノ

ミノメチルアミン、エチルアミノエチルアミン、エチル アミノプロピルアミン、エチルアミノブチルアミン、プ ロピルアミノメチルアミン、プロピルアミノエチルアミ ン、プロピルアミノプロピルアミン、プロピルアミノブ チルアミン、ブチルアミノメチルアミン、ブチルアミノ エチルアミン、ブチルアミノプロピルアミン、ブチルア ミノブチルアミン、ピリジン、ピロール、ピペラジン、 ピロリジン、ピペリジン、ピコリン、モルホリン、メチ ルモルホリン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロノナン、ジアザビシクロウンデセンなどを挙げること ができる。これらのアルカリ触媒は、1種あるいは2種 以上を同時に使用してもよい。

【0070】上記アルカリ触媒の使用量は、化合物 (2)~(3)中のR'O-基の総量1モルに対して、 通常、0.00001~0.5モル、好ましくは0.0 0005~0. 1モルである。アルカリ触媒の使用量が 上記範囲内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化 の恐れが少ない。

【0071】このようにして得られる(A)成分の加水 分解縮合物の分子量は、GPC法による重量平均分子量 20 ~100℃、好ましくは15~90℃である。 で、5万~1,000万、好ましくは10万~900 万、さらに好ましくは20万~800万である。5万未 満では、十分な誘電率と弾性率が得られない場合があ り、一方、1,000万より大きい場合は、途膜の均一 性が低下する場合がある。また、このようにして得られ る (A) 成分の加水分解縮合物は、粒子状の形態をとっ ていないことにより、基板状への塗布性が優れるという 特徴を有している。粒子状の形態をとっていないこと は、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認 される。

【0072】以上のように、組成物(2)では、(A) 成分を構成する化合物 (2) ~ (3) を、(D) アルカ リ触媒の存在下に加水分解・縮合して、加水分解縮合物 の重量平均分子量を5万~1,000万となすが、その 後、組成物のpHを7以下に調整することが好ましい。 ここで、pH調整剤としては、無機酸や有機酸が挙げら れる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、フ ッ酸、リン酸などを挙げることができる。また、有機酸 としては、例えば、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペ ンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナ 40 ン酸、デカン酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン 酸、アジピン酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリッ ト酸、アラキドン酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン 酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイ ン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p ートルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロ 口酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ 酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル 酸、クエン酸、酒石酸などを挙げることができる。

【0073】上記pH調整剤による組成物のpHは、7 50

以下、好ましくは1~6に調整される。このように、加 水分解縮合物の重量平均分子量を5万~1,000万と なしたのち、上記pH調整剤により上記範囲内にpHを 調整することにより、得られる組成物の貯蔵安定性が向 上するという効果が得られる。 p H調整剤の使用量は、 組成物のpHが上記範囲内となる量であり、その使用量 は、適宜選択される。

30

【0074】本発明の組成物(2)は、(A)成分の加 水分解縮合物を、有機溶媒に溶解または分散してなる。 10 この有機溶媒としては、組成物(1)に用いられる

(C) 有機溶媒と同様のものが挙げられるので、その説 明については、省略する。なお、組成物(2)は、上記 の有機溶媒を含有するが、(A)成分を加水分解および /または縮合する際に、同様の溶媒を使用することがで

【0075】具体的には、水およびアルカリ触媒を添加 した上記有機溶媒中に、(A)成分を一括または断続的 あるいは連続的に添加したのち、さらに加水分解および 縮合反応を行う。この際の反応温度としては、通常、0

- 【0076】その他の添加剤;本発明で用いられる組成 物(2)には、さらに界面活性剤などの成分を添加して もよい。界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面 活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性 剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、シリコ ーン系界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性 剤、含フッ素界面活性剤などを挙げることができる。な お、本発明の組成物中には、塗膜を均一にするために、 シリカ粒子が含まれていないことが望ましい。
- 【0077】組成物(2)の調製方法;組成物(2)を 30 調製するに際しては、例えば、水と(D)アルカリ触媒 を添加した有機溶媒中に、(A)シラン化合物を一括ま たは断続的もしくは連続的に添加して、通常、0~10 0℃、好ましくは15~90℃で1~12時間撹拌し、 加水分解および縮合反応を行う。調製の各段階におい て、濃縮または有機溶媒添加による希釈を行うことで任 意の濃度に調整できる。また、pH調整剤を添加する場 合は、加水分解反応終了後の任意の段階で添加すること ができる。
  - 【0078】組成物(2)の調製方法の具体例として は、下記(1)~(12)の方法などが挙げられる。
  - (1) 水、(D) アルカリ触媒および有機溶媒からなる 混合物に、所定量の(A)シラン化合物を加えて、加水 分解・縮合反応を行ない、(A)シラン化合物の加水分 解縮合物を得る。
  - (2) 水、(D) アルカリ触媒および有機溶媒からなる 混合物に、所定量の(A)シラン化合物を連続的あるい は断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行ない、
  - (A) シラン化合物の加水分解縮合物を得る。
  - (3) 所定量の(A) シラン化合物および有機溶媒から

反応を行ない、(A)シラン化合物の加水分解縮合物を 得る。なお、本発明において、(A)シラン化合物を加 水分解・縮合する際の反応液の固形分濃度は、通常、

0.1~50重量%である。

なる混合物に、水、(D)アルカリ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合 反応を行ない、(A)シラン化合物の加水分解縮合物を 得る。

(4) 所定量の(A) シラン化合物および有機溶媒からなる混合物に、水、(D) アルカリ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応を行ない、(A) シラン化合物の加水分解縮合物を得る。

【0079】(5)所定量の(A)シラン化合物、

- (D) アルカリ触媒および有機溶媒からなる混合物に、 水および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を加え て、加水分解・縮合反応を行ない、(A) シラン化合物 の加水分解縮合物を得る。
- (6) 所定量の(A) シラン化合物、(D) アルカリ触 媒および有機溶媒からなる混合物に、水および必要に応 じて有機溶媒からなる混合物を連続的あるいは断続的に 添加して、加水分解・縮合反応を行ない、(A) シラン 化合物の加水分解縮合物を得る。
- (7) 所定量の水および必要に応じて有機溶媒からなる 混合物に、所定量の(A) シラン化合物、(D) アルカ リ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を加 えて、加水分解・縮合反応を行ない、(A) シラン化合 物の加水分解縮合物を得る。
- (8) 所定量の水および必要に応じて有機溶媒からなる 混合物に、所定量の(A) シラン化合物、(D) アルカ リ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を、 連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応 を行ない、(A) シラン化合物の加水分解縮合物を得 る。
- 【0080】(9) 所定量の水、(A) シラン化合物および必要に応じて有機溶媒からなる混合物に、所定量の(D) アルカリ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、
- (A) シラン化合物の加水分解縮合物を得る。
- (10) 所定量の水、(A) シラン化合物および必要に 応じて有機溶媒からなる混合物に、所定量の(D) アル カリ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物 を、連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合 反応を行ない、(A) シラン化合物の加水分解縮合物を 40 得る。
- (11) 所定量の(D) アルカリ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物に、所定量の水、(A) シラン化合物および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、(A) シラン化合物の加水分解縮合物を得る。
- (12) 所定量の(D) アルカリ触媒および必要に応じて有機溶媒からなる混合物に、所定量の水、(A) シラン化合物および必要に応じて有機溶媒からなる混合物を、連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合

【0081】このようにして得られる本発明の組成物

32

- (2)の全固形分濃度は、好ましくは、2~50重量%、好ましくは2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~50重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安10定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上記有機溶媒による希釈によって行われる。
  - 【0082】このようにして得られる本発明の組成物(2)は、必要に応じて、フィルターでろ過したのち、使用することができる。フィルターは、ポリエステル、ポリカーボネート、セルロース、セルロースアセテート、ポリプロピレン、ポリエーテルサルホン、四フッ化エチレン(PTFE)、ポリアミドなどの材質のものを使用することができる。好ましくは、孔径0.2μm以下のPTFE製フィルター、特に好ましくは、孔径0.05μm以下のPTFE製フィルターを用いることが、組成物中の異物を除去し、得られる塗膜の均一性が優れる点で好ましい。上記のようなフィルターは、材質や孔径の異なるものを組み合わせて使用することができ、また、同一材質や孔径の異なるものを、複数個組み合わせて使用することもできる。

【0083】組成物(2)を用いた膜の形成方法

- (2);本発明の組成物(2)を用いて膜を形成するには、組成物(1)におけると同様である。すなわち、まず本発明の組成物(2)を基板に塗布し、塗膜を形成する。ここで、本発明の組成物を塗布することができる基板としては、半導体、ガラス、セラミックス、金属などが挙げられる。また、塗布方法としては、スピンコート、ディッピング、ローラーブレードなどが挙げられる。本発明の組成物は、特にシリコンウエハ、SiO.ウエハ、SiNウエハなどの上に塗布され、絶縁膜とすることに適している。
  - 【0084】この際の膜厚も、乾燥膜厚として、厚さ 0.1~3μm程度の塗膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することができ、加熱処理条件としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下もしくは酸素濃度100ppm以下にコントロールした減圧下で、450℃以下の温度で処理することが好ましい。また、上記の(A)成分の硬化速度を制御するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧などの雰囲気を選択することができる。

# 【0085】本発明の膜の用途

ン化合物および必要に応じて有機溶媒からなる混合物 本発明の膜は、絶縁性に優れ、高弾性率であり、さらに を、連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合 50 塗布膜の均一性、誘電率特性、塗膜の耐クラック性、塗

膜の表面硬度に優れることから、LSI、システムLS I, DRAM, SDRAM, RDRAM, D-RDRA Mなどの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素子の表面コ ート膜などの保護膜、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶 表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用である。 [0086]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体 的に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例 を概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載 により本発明は限定されるものではない。また、実施例 10 本文中に記載 および比較例中の部および%は、特記しない限り、それ ぞれ重量部および重量%であることを示している。

### 【0087】実施例1

(1) テトラメトキシシシラン140.5g、メチルト リメトキシシラン182.7g、ジメチルジメトキシシ ラン56.0g、プロピレングリコールモノプロピルエ ーテル394.0gの混合溶液に、マレイン酸10.0 gを水116. 8gに溶かした水溶液を室温で1時間か けて滴下した。混合物の滴下終了後さらに60℃で1時 ことにより、重量平均分子量が3,500のポリシロキ サンゾルを得た。

(2) 上記(1) で得たポリシロキサンソル100gに 対し、ポリエチレンオキシドブロックーポリプロピレン オキシドブロックーポリエチレンオキシドブロック共重 合体 [三洋化成 (株) 製、ニュポールPE 6 1] 8. 9 gを添加し、得られた混合物を8インチシリコンウェハ 上にスピンコート法により塗布し、80℃で5分間、次 いで200℃、窒素下で5分間加熱したのち、さらに真 空下で340℃、360℃、380℃の順でそれぞれ3 30 研磨時間:60秒 0分間ずつ加熱し、さらに425℃で1時間加熱し、無 色透明の膜を形成した。さらに、得られた膜を下記のと おり評価した。結果を表1に示す。

### 【0088】膜および膜形成用組成物の評価

1. 膜の元素分析

膜の元素組成は、X線光電子分析法(XPS)より求め た。

#### 2. 膜密度

密度は、ラザフォード後方散乱法および水素リコイル前 方散乱法の分析結果より算出した。

#### 3. 炭素含有量

膜密度の測定と同様に、ラザフォード後方散乱法および 水素リコイル前方散乱法の分析結果より算出した。

【0089】4. 膜厚

多入射角エリプソメーター(Rudolph Tech nologies社製、Spectra Laser 200) にて測定した。

5. B I H 法による空孔分布測定

COULTER社製、OMNISORP 100/36 O SERIESを用いて、BJH法で測定し、下記基 50 キャリア送液速度:1ml/min

準にしたがって評価した。

〇;10 n m以上の細孔が5%以下。

×:10nm以上の細孔が5%を超える。

用いて、連続剛性測定法により測定した。

6. 電子顕微鏡観察による空孔径測定 本文中に記載

【0090】7. 弾性率(ヤング率)

ナノインデンターXP (ナノインスツルメント社製)を

8. 凝集破壊強度

(18)

9. 屈折率

多入射角エリプソメーター(Rudolph Tech nologies社製、Spectra·Laser 200) にて測定した。

10.1%重量減少温度

セイコー電子工業(株)製、SSC5200熱重量分析 装置 (TGA) を用いて、窒素雰囲気中、10℃/mi nの昇温速度で加熱し、1%重量減少温度を測定した。

【0091】11. 誘電率

間反応させたのち、滅圧下で生成メタノールを留去する 20 得られた膜に対して、蒸着法によりアルミニウム電極パ ターンを形成させ誘電率測定用サンプルを作成した。該 サンプルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒュ ーレットパッカード (株) 製、HP16451B電極お よびHP4284AプレシジョンLCRメータを用いて CV法により当該塗膜の誘電率を測定した。

12. CMP耐性

得られた膜を以下の条件で研磨した。

スラリー:シリカー過酸化水素系

研磨圧力:300g/cm<sup>2</sup>

評価は、以下の基準にて行った。

〇:変化なし

△:一部にはがれやキズがある。

×:全て剥がれる。

【0092】13. 重量平均分子量・数平均分子量 下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ 一 (GPC) (屈折率, 粘度, 光散乱測定) 法により測 定した。

試料溶液:シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃 40 度が 0.25%となるように、10mMのLiBrを含 むメタノールで希釈し、GPC(屈折率,粘度,光散乱 測定)用試料溶液とした。

装置:東ソー(株)製、GPCシステム モデル GP C - 8020

東ソー (株) 製、カラム Alpha 5000/300

ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器 モデル T-60 デュアルメーター

キャリア溶液:10mMのLiBrを含むメタノール

# カラム温度:40℃ 【0093】合成例1

(メタ) アクリル系重合体の合成;100mlのフラス コに、メタクリル酸イソブチル18.32g、メタクリ ル酸3- (トリメトキシシリル) プロピル1. 68g、 アゾイソブチロニトリル (AIBN) 0.33g、2-メルカプトエタノール0.20gおよび3-メトキシメ チルプロピオネート30gを入れ溶解させた。 系内を窒 素ガスで置換したのち、80℃のオイルバスで加熱しな がら、7時間撹拌すると粘稠なポリマー溶液が得られ た。GPC法による平均分子量を測定すると、数平均分 子量が4,830、重量平均分子量が8,900であっ

# 【0094】実施例2

(1) テトラメトキシシシラン91.2g、メチルトリ メトキシシラン292.3gプロピレングリコールモノ プロピルエーテル387.0gの混合溶液に、マレイン 酸10. 0gを水119. 4gに溶かした水溶液を室温 で1時間かけて滴下した。混合物の滴下終了後さらに6 0℃で1時間反応させたのち、減圧下で生成メタノール 20 を留去することにより、重量平均分子量3,000のポ リシロキサンゾルを得た。

(2) 上記(1) で得られたポリシリカゾル100gに 対し、合成例1で得られた(メタ)アクリル系重合体溶 液21.2g(固形分含量8.5g)を加え、60℃で 1時間攪拌した。得られた溶液を8インチウェハ上にス ピンコートにより塗布し、ホットプレートにより80℃ で5分、200℃で5分乾燥したのち真空下425℃で 1時間焼成すると透明な塗膜が得られた。実施例1と同 10 様にして評価を行った。結果を表1に示す。

# 【0095】比較例1

実施例1において、ポリエチレンオキシドブロックーポ リプロピレンオキシドブロックーポリエチレンオキシド ブロック共重合体を使用しない以外は、実施例1と同様 にして組成物を製造し、基板に塗布し加熱して、膜を形 成した。得られた膜の評価を実施例1と同様にして行っ た。結果を表1に示す。

[0096]

【表1】

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	_	•				
I	1		1		1	
I	١	実施例 1	I	実施例2	I	比較例1
	ı		ļ		١	
SiOxCyHz; x	١	1.55	I	1.60	İ	1.55
l y	ļ	0.90	1	0.80	I	0.90
Ž	Ī	2.70	Ì	2.40	ı	2.70
膜密度(g/c m³)	ı	0.84	ļ	0.82	I	1.30
炭素含有量(atm/cm³)(×10²¹)	ļ	6. 12	١	5. 26	Ī	9.12
膜厚 (μm)	ļ	0.90	ı	0. 85	I	1.01
B J H法空孔	1	0	ł	0	١	0 1
電子顕微鏡空孔(個/cm²)	ı	0	I	0	İ	0
弾性率(GPa)	ļ	3. 2	İ	3.4	ļ	7.0
凝集破壊強度(MPa)		40	I	38	١	. 65
屈折率	ı	1.245	ı	1.235	١	1.351
1%重量減少温度 (℃)	l	440	Į	450	1	450
誘電率	l	2. 2	ı	2. 3	١	2.7
CMP耐性	ı	0	1	0	ļ	0 1
	۱ .	<u>-</u>	İ		ł	1

#### - 【0097】実施例3---

25%アンモニア水溶液5g、超純水320gおよびエ 40 タノール600gの混合溶液中にメチルトリメトキシシ ラン15g(完全加水分解縮合物換算7.4g)とテト ラエトキシシラン20g (完全加水分解縮合物換算5. 8g)を加え60℃で3時間反応をさせたのち、プロピ レングリコールモノプロピルエーテル200gを加え、 その後、減圧下で全溶液量200gとなるまで濃縮し、 固形分含有量6.6%の組成物溶液を得た。得られた組 成物の重量平均分子量は、520万であった。得られた 組成物を8インチシリコンウエハ上にスピンコート法に より塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下20 50

0℃で5分間加熱したのち、さらに真空下で340℃、 360℃、380℃の順でそれぞれ30分間ずつ加熱 し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の 膜を形成した。結果を表2に示す。

# 【0098】実施例4

実施例3記載の組成物200gをさらに全容液量140 gとなるまで濃縮し、その後、酢酸の10%プロピレン グリコールモノプロピルエーテル溶液10gを添加し、 固形分含有量8.8%の組成物溶液を得た。得られた組 成物の重量平均分子量は520万であった。また、電導 度滴定により求めた残留シラノールのカウント数は、酢 酸添加前後で変化が認められなかった。得られた組成物

を8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗 布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で 5分間加熱したのち、さらに真空下で340℃、360 ℃、380℃の順でそれぞれ30分間ずつ加熱し、さら に真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成 した。結果を表2に示す。

【0099】比較例2

超純水320gの代わりに超純水32g、エタノール6 00gの代わりにエタノール888gを用いた以外は、 実施例1と同様の操作を行い、固形分含有量6.6%の 10 【表2】

組成物溶液を得た。得られた組成物の重量平均分子量 は、12,000であった。得られた組成物を8インチ シリコンウエハ上にスピンコート法により釜布し、大気 中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱 したのち、さらに真空下で340℃、360℃、380 ℃の順でそれぞれ30分間ずつ加熱し、さらに真空下4 25℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。結果 を表2に示す。

[0100]

			┺.	•			
	- 1		-		-		-
1	İ	実施例3	1	実施例4		比較例3	1
	٠		-		-		1
SiOxCyHz;x	1	1.725	1	→ '	1	>	1
l y	1	0. 55	1	<b>→</b> .	- 1	<b>→</b>	1
Z	-	1.65	1	$\rightarrow$	1	<b>→</b>	İ
膜密度(g/c m³)	1	0.86	1	0. 90	I	1. 35	ı
炭素含有量(atm/cm²)(×10²¹)	1	4. 34	-	4.65	-	7.14	1
膜厚 ( μ m)	1	0. 75	1	0.81	1	0.95	I
B J H 法空孔	1	0	1	0	1	0	1
電子顕微鏡空孔(個/cm²)	1	0	1	0	1	0	1
弾性率 (GPa)	1	4.5	1	5. 0	1	6.0	1
凝集破壊強度 (MPa)	١	65	I	66	I	75	1
屈折率	1	1.293	١	1. 315	1	1. 385	1
1%重量減少温度 (℃)	1	450	1	455	ı	440	ı
誘電率		2. 2	ł	2. 3	I	2.7	1
CMP耐性	1	0	1	0		0	1
	١		İ		1		1

[0101]

優れる。

【発明の効果】本発明の膜は、誘電率特性、機械強度に 30

フロントページの続き

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4J038 CG002 DD002 DE002 DF002

DL051 HA236 JA35 JC32

JC38 KA04 KA06 NA11 NA17

NA19 NA21 PA19 PB09 PC02

PC03 PC08

5F058 AA10 AC03 AF04 AG01 AH01

AH02 BA20 BC05 BF46 BH01

BJ01 BJ02